

金属材料研究所 材料分析研究コア（電子顕微鏡）料金表 2026年1月22日～

【税込価格】

装置名称	メーカー/型番	ARIM事業利用料金		成果非公開利用料金	ARIM事業装置ID
		設備利用+データ提供 学内料金（円/1H）	設備利用 学外料金(1)（円/1H）	学外料金(2)（円/1H）	
超高分解能透過電子顕微鏡	JEOL JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	4,510	7,216	21,340	TU-504
超高分解能透過電子顕微鏡	JEOL JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	4,510	7,216	21,340	TU-522
分析電子顕微鏡	TOPCON EM-002B	3,300	5,280	6,600	TU-516
透過電子顕微鏡	JEOL JEM-2000EXII	2,200	3,520	4,400	TU-517
分析透過電子顕微鏡	JEOL JEM-2100Plus	3,520	5,632	6,270	TU-520
集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System	Quanta 3D	3,300	5,280	6,930	TU-507
集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System	Versa 3D	5,610	8,976	11,000	TU-508
集束イオンビーム加工装置 (技術代行適応料金)※1	Quanta 3D及びVersa 3D	4,455	7,128	8,965	TU-507,TU-508
プラズマ集束イオンビーム加工装置	TESCAN Amber-X	4,180	6,688	42,240	TU-521
薄膜断面試料作製装置 (イオンスライサ)	JEOL EM-09100IS	2,200	3,520	4,070	TU-518
イオンミリング加工装置	が 社 PIPS II	1,210	1,936	2,860	TU-511
イオンミリング加工装置	FISCHIONE MODEL1010	440	704	1,650	TU-512
熱分析装置 (DSC-DTA)	RIGAKU Thermo plus EVO II	770	1,232	1,760	TU-514
高出力全自動水平型多目的X線回折装置 (XRD)	RIGAKU SmartLab 9SW	1,320	2,112	4,400	TU-515
技術支援料A ※2	-	3,300	3,300	8,690	-
技術支援料B ※2	-	6,490	6,490	12,980	-
試料作製準備室使用料 (半日4H単位で使用) ※3	-	880/4H	1,408/4H	2,640/4H	-

■FIB 試料用グリッド：Cu(550円/1個), Si(3,124円/1個), Mo(2,970円/1個), Ti(3,080円/1個), Ni(1,980円/1個)

■FIB Amber-X用アパーチャー使用料：600 um (143円/1H), 800 um (352円/1H)

※1 技術代行の場合は、両装置の平均の価格とする。機器利用の場合は、各装置の価格とする

試料作成に伴う予備装置の利用等があった場合、実費相当額を加算して請求する（分析コア利用料に関する申合せによる）

※2 「東北大学金属材料研究所材料分析研究コア分析電顕室設備等使用内規」第5条に関わる支援。時間外利用については、表中料金の1.25倍とする。

※3 本表に記載されている他に、個別の課題の実施に必要な消耗品が発生した場合は、実費相当額を加算して請求する（分析コア利用料に関する申合せによる）